光ファイバーAE (アコースティック エミッション)を使った保温材下 腐食の検査技術	住友化学(株)	生産技術 多 末 森	<sub>奇セン</sub> 田 次	/タ豊秀久	. 和彦和
Inspection Technique for CUI (Corrosion under Insulation) by Using Fiber Optical AE Sensor	Sumitomo Chemica Process & Produ	al Co., Ltd.	hnolc	ogy C	enter

Corrosion under insulation (CUI) is one of the degradation phenomena that have become a serious problem in recent years especially in chemical plants that have been operating for a long time. Development of a CUI inspection technique which doesn't require the removal of insulation and which is applicable to explosion-proof petrochemical plants is strongly needed. So we focused attention on optical fiber Doppler sensors which already have the explosion-proof characteristics, and we tried to develop a new CUI inspection technique using them. The development of this new inspection technique is explained.

# はじめに

# 1. 保温材下腐食に関する国内外の対応状況

欧米先進国や国内の化学プラント、石油精製プラ ント、発電所等において保温材下腐食(Corrosion under Insulation、以下「CUI」)が大きくクローズアッ プされだしたのは1980年代からである。これは、 1973年の第一次オイルショック以降、それまで149℃ 以上の箇所で使用されていた保温材が100℃以下の低 温域でも使用されだしたことによるようである。国 内では1988年に高圧ガス保安協会(以下、KHK)より 外面腐食に関する報告書が提出され、2007年から 2011年にかけて、財団法人エンジニアリング振興協 会(以下、エン振協)で非破壊検査技術とモニタリン グ技術の適用についての検討が行われている。2007 年度のエン振協報告によれば、ガイド波超音波法、 リアルタイム放射線法、パルス渦流法等の非破壊検 査技術が開発され現場適用されてきたが完全なもの はなく、そのため、優先順位を定めて保温材を全長、 全面剥がしての目視検査が推奨されている<sup>1)</sup>。

# 2. 当社での対応状況

2007年度以降の生産技術センターの対応状況を以下に示す。2007年度には、Fig.1に示すようなモックアップ配管(模擬配管)を作製して実験室にて光ファイバーアコースティックエミッション(Acoustic Emission、

Toyokazu Tada Hidehiko Suetsugu Hisakazu Mori



Fig. 1 Photo of the mock-up pipe

以下「AE」)センサによる錆びこぶ検出の適用化検討を 行い、2008年度以降では、現場適用も含めて環境ノイ ズの分別技術の開発に取り組んでいる。2008年度には さらにモックアップ配管を用いて防食対応保温材構造 (外装板構造)の検討、そして、60℃~100℃の温度範 囲においての最適な下地塗装材の選定検討を行ってき た。2009年度についても引き続きこれらの検討を行 ってきたところであるが、ここでは光ファイバーAE センサを用いた検査方法の開発状況について述べる。

# 光ファイバーAE法を用いたCUI検査技術の開発<sup>2)</sup>

炭素鋼製の機器・配管におけるCUIは、長年稼動 している化学プラントにおいて近年特に深刻化して きている劣化現象の一つである。特に屋外配管につ いては高所のパイプラック上への設置など、外面か らの目視点検が難しいのに加え、総距離が長いため に、保温材を取り外しての目視検査よりも有効な CUIの検査手法が確立されていない。また、これら の検査費用のうち70~80%が足場と保温材解体に占 められていることも大きな問題の一つである。した がって、保温材の取り外し作業を必要とせず、かつ防 爆要求の多いプラント設備に対応した配管のCUI検査 技術の開発が強く求められている。我々は、光ファイ バードップラー (Fiber Optical Doppler、以下「FOD」) センサが元々防爆性能を有していることに着目し、 新しいCUI検査技術の開発を試みた。

# 1. 従来の配管でのCUI検査手法の比較と課題

technique for nines

これまで配管に適用されてきた各種検査手法の特 徴をTable 1に示す。検査精度の良い手法では、短距 離の検査しかできず、長距離の検査(5m程度)が可能

Comparison of the CUI inspection

teeninque for pipes					
	Ultrasound	Eddy Current	Radio graphic		
Inspection	Testing (UT)	Testing (ECT)	Testing (RT)		
method	Ultrasonic guided waves	Pulsed ECT	Real-Time RT		
Influence of internal fluid	YES	NO	YES		
Inspection of long distance	Applicable	Not Applicable	Not Applicable		
Removal of insulations	Need	No need (Less than 80mm in thickness)	No need		
Corrosion	localized corrosion	General	localized corrosion		
can be	(10% depth level of	corrosion like	( $\phi 2$ mm through		
detected	sectional area)	concave	wall hole)		
Inspection accuracy	Not good	Not good	Good		

な手法では検査精度が悪い。そのため、先述したよ うに断熱材を取り外しての検査を多くの事業所では 行っているが、多額の費用をかけて全面解体検査を 行ったとしても腐食が発見されるのは、1000系統の 内2~3系統程度であり、非常に効率が悪いことが問 題とされている。

#### 2. FODを用いたAEモニタリングの原理<sup>3)</sup>

配管CUIの有効な検査手法を確立するため、腐食 とAEの関係に注目した。Fig.2にAEの発生メカニズ ムのイメージ図を示す。まず活性な腐食の進行によ り、局所的に腐食生成物(錆びこぶ)の剥離や割れが 発生する。その際に内部に蓄えていたひずみエネル ギーが微小な弾性波として放出される。この弾性波 は可聴音から500kHzの比較的低周波数であるため、 広い範囲に伝播することが知られている。したがっ て、AEセンサで、腐食剥離や割れに起因する弾性波 をAEとして検知することによって、腐食の存在を感 知することができる。すなわちAEの観測された配管 のみ保温材の解体・目視検査を行うことで、CUI検 査の効率を向上することができると考えられる。



AE法は腐食のモニタリングに優れており、タンク の底板の腐食損傷評価などには一部で既に適用されて いるが、実際には様々な問題がある。AE法にはこれ までピエゾ型のセンサが用いられてきたが、①風、振 動、騒音、内部流体の擦過音などの影響をうけやす い、②センサの感度を高くしようとすると、測定範囲 が狭帯域となるため、ノイズの周波数帯域と重なった ときに分別できない、③ケーブルの耐電磁ノイズ性が 悪いため長距離の使用ができない、④非防爆性であ る、⑤適用温度範囲が限られるなどといった問題点が ある。そこでこれらの問題を解決するために、近年開 発された光ファイバーAE技術に着目した。

光ファイバーは通信システムのイメージが強いが、 光ファイバーのドップラー効果を利用することによっ て、センサとして用いることできる。今、光ファイバー 内に光源から音速*C*,周波数*fo*の光波が入射されたと きに、光ファイバーが速度*v*で長さ*L*伸びたとする

Table 1

(Fig. 3参照)。このときドップラー効果により、周波 数 $f_0$ が $f_1$ に変化すると、変化後の周波数 $f_1$ はドップ ラー効果の公式により、Eq. 1のようにあらわすこと ができる。





$$f_1 = \frac{C - v}{C} f_0 = f_0 - \frac{v}{C} \cdot f_0$$
 (Eq. 1)

したがって、変化後の周波数 $f_1$ を、入射前の周波数 $f_0$ から $f_d$ 分変調したとして考えると、 $f_d$ はEq.2となる。

$$f_d = f_0 \cdot \frac{v}{C} \tag{Eq. 2}$$

これとEq.3に示した波の公式により、 $f_a$ はEq.4のように表すことができる。

$$C = f_0 \cdot \lambda \tag{Eq. 3}$$

$$f_d = f_0 \cdot \frac{v}{C} = \frac{f_0}{C} \cdot v = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{dL}{dt}$$
(Eq. 4)

Eq.4は、光ファイバーの伸縮速度を光波の周波数 変調として検出することができることを示している。 すなわち、光ファイバーの周波数変調faを読み取るこ

とによって、光ファイバーに加わった、ひずみ (弾性 波や応力変化等)を検知することが可能となる。この ような光ファイバーが伸縮した際のドップラー効果 を利用したセンサとしてFODセンサが開発されてい る (Fig. 4参照)。このセンサは、感度を高め、かつ全 方位からの受信を可能にするため、光ファイバーを コイル状に巻いたもので、ファイバーの伸縮速度に 比例した出力が得られること、1Hz~1MHzと受信帯 域が広帯域であること、-200℃から250℃までと広い 温度範囲を持つことなどが特徴として挙げられる。 また、FOD センサの利点については①高絶縁性であ る、②耐電磁ノイズ性が高い、③防爆性で電気火花 が発生しない、④長距離測定が可能、⑤広い使用環 境を持つ、などが挙げられる。したがって、FODセ ンサを用いることで、上述した従来のピエゾ型AEセ ンサの欠点②~⑤については原理的に解決すること ができる。

Fig. 5に配管CUIの光ファイバーAEモニタリングシ ステムのイメージ図を示す。まず計測回路のレーザー





Fig. 5 Image of optical fiber of CUI

ドップラー振動計の光源から周波数6の光波が入射 される。FODセンサに入射された光波は腐食剥離や 割れなどに起因して生じるAEを受信して周波数が fo-faに変調する。一方、計測回路ではヘテロダイン 干渉法を用いて周波数変調量を検出する。具体的に はAOM (周波数変調器) により周波数fM (80MHz) の 基準光を加え、fo+fMに変調される。そして、センサ 回路からのレーザー光と計測回路からのレーザー光 の周波数の差 $f_M$  +  $f_a$ が導かれ、検知器で $f_a$ が検出さ れ、FV変換器によって電圧Vに変換されて出力され る。このとき得られた原波形データに周波数解析 (FFT)を用いて、横軸が周波数、縦軸がスペクトルパ ワーとなる抽出データに変換する。このような波形 解析も、ノイズと腐食起因のAEを分別する技術とし て重要である。

#### 3. CUI検査検討のためのモックアップ配管

これまで光ファイバーAEは地下貯槽掘削に伴う岩 盤のゆるみ領域の評価などでの実績はあるが、CUIの

評価に用いられた実績はない。そこで、このような 光ファイバーAEによるCUI検査技術の開発が可能で あるかを検討するために、Fig.6に示すようなモック アップ配管を作製した。5mの炭素鋼配管に保温材を とりつけ、配管の内部には、加熱装置によって加熱 されたシリコン油を循環させている。またCUIを効 率よく発生させるために、ちょうど濡れ乾きが生じ る程度に滴下量を微調整した純水と食塩、さらにシ リコン油による60~70℃の加熱によって、人工的に 腐食を促進させる。FODセンサをこのモックアップ 配管の任意の位置に設置して、この腐食部位からの AEに関するデータを収集した。

今回の検討には、65mの光ファイバーを積層のコ イル状に積み上げた、市販の積層型のFODセンサを 用いた(Fig. 7参照)。このセンサは積層型に光ファ イバーを設置することによって、感度が非常に高く なっていることが特徴である。広帯域であるにもか かわらず、狭帯域である従来のピエゾ型AEセンサと 同等、もしくはそれ以上の受信感度を持っている。



Fig. 6 Mock-up piping for CUI inspection investigation





積層型FODセンサは配管に設置するときはU字ボル トで固定し、フランジに設置するときはクランプで 固定する。いずれも脱着が非常に簡単であり、また ピエゾ型AEセンサと同様、市販の接触媒質を介して 送受信ができる。

#### 4. モックアップ配管での測定結果<sup>4)</sup>

#### (1) 腐食初期段階でのAE検出検討結果

2007年11月に腐食初期段階でのAE検出検討に関 する実験を行った。この時点での配管の腐食状況を Fig.8に示す。まだ錆びこぶは発生しておらず、白く 見えているのは再結晶した塩である。FODセンサは 腐食部位から300mmの位置に設置した。AEの検出結 果をFig.9に示す。棒グラフが一時間あたりのAE検 出数、折れ線グラフが累積のAE検出数を示している。

このように腐食初期の段階でAEが計測可能である ことを実証した。また、グラフからわかるように純 水と塩の滴下を開始し、かつ昇温をした後にAEは急 激に増加している。また、ある程度時間がたつとAE は収束していき、また油温を下げるとAEが増加して いる。このように錆びに濡れ乾きや温度変化を加え るとAEの検出数が増加するのが大きな特徴である。

また今回収録したAE波形は、Fig. 10に示すように、





Fig. 8

Corrosion of piping (1st monitor: 11/2007)









**Fig. 10** Data of original AE and Frequency spectrum pattern

周波数が100kHz超のもの、50k~100kHzのもの、10k ~50kHzのものという三つのパターンに分類された。 これは光ファイバーAEが広帯域の受信が可能である がゆえの結果といえる。実機の計測ではこれらの三 つのパターンの周波数のうち、測定ノイズと重なら ない周波数帯域のAEを選択的に受信することが重要 となる。またAEは低周波ほど遠くに伝播するが、測 定ノイズは低周波側に発生しやすいため、なるべく低 い周波数でかつノイズとは重ならないパターンのAE を計測する必要がある。

#### (2) AEの検出可能距離の検討結果

2008年1月にAEの検出可能な距離の検証を行っ た。この時点での配管の腐食状況をFig. 11に示す。 錆びこぶが発生し、腐食の進行が見てとれる。FOD センサは腐食部位から2,000mm, 3,000mm, 3,900mm の位置に設置した。3,900mmの位置でのAEの検出結 果をFig. 12に示す。このように最大3,900mmでも充 分な感度でAEの検出が可能であることが確認され た。また、三つのAEパターンのうち、50k~100kHz の周波数が最も多く検出されていることがわかった。 これは今後の課題となるが、実機での測定において この範囲の周波数にノイズが存在していなければ効 率よく腐食起因のAEを検出することが可能となる。



Fig. 11

Corrosion of piping (2nd monitor: 01/2008)



**Fig. 12** AE hits by corrosion progress at 3,900mm

(3) 配管とフランジ部のAE検出結果の比較

2008年3月に配管とフランジ部のAE検出の比較を 行った。この時点での配管の腐食状況をFig. 13に示 す。錆びこぶがさらに成長し、錆びこぶに一部亀裂 が発生している。FODセンサはFig. 14に示すように 腐食部位から3,900mmの配管と3,950mmのフランジ 部に設置した。



Fig. 13 (

Corrosion of piping (3rd monitor: 03/2008)



Fig. 14 The position of FOD sensor installation

Fig. 15に配管とフランジ部とのAE検出の比較結果 を示す。この結果より配管本体より感度は劣るもの の、フランジ部でも良好にAEを検出していることが 確認された。フランジでAEが検出できるならフラン ジ部のみの保温材の解体で、AEを計測することが期 待できる。



piping and flange

### (4) 腐食進展度とAE検出数の検討

2008年1月時点での腐食部位からのAE検出数と、 さらに腐食が進展した2008年3月時点での腐食部位 からのAE検出数とを比較するため、同じ3,900mmの 位置にFODセンサを設置して計測した結果を比較し た。その結果をFig. 16に示す。ただし、2008年1月 のAE計測は240分までしか計測していない。この図 からも明らかなように、3月のAE検出数は1月に比べ て、腐食進展に伴って明らかに増加していることが わかる(240分の時点でAE総検出数は10倍程度)。AE 法は腐食面積や減肉深さを定量化することはできな いが、錆びこぶの体積が増加するとAEの発生する確 率が増加することから、AE検出数をカウントするこ とによって、腐食進展度をある程度相関性を持って 評価できると考えられる。



Fig. 16 Comparison of the number of AE hits 01/2008 and 03/2008

# 実機での光ファイバーAE測定<sup>5)</sup>

### 1. 静機器の選定と環境ノイズ分別

配管では先述したように、完全とはいえないまで も保温材を解体しないでも検査は可能であるが、機 器については保温材を解体しての目視検査以外の方 法がない。そこで、CUIが顕在化していると思われ る稼働中の縦型反応器(内径3.8m, 塔長約28m)を測 定対象機器として選定した。本機器では塔全面の断 熱材を取り外して、CUIによって生じた錆びのケレ ンによる除去作業が計画されていた。従って、この 工事にあわせてFODセンサを設置し、錆びの除去前 後でAE測定を行い、内部流体による環境ノイズが含 まれる条件下で、腐食からのAEの分別性について検 討することとした。尚、縦型反応器のような静機器 に対して目視検査以上の有効なCUIの検査手法が確 立されれば、足場の設置および保温材の解体が不要 となり大きなコストメリットが得られる。

# 2. 縦型反応器へのFODセンサ取り付け

縦型反応器へのFOD センサの取り付け位置をFig. 17 およびFig. 18に示す。高さ方向は反応器本体の下 鏡と胴体との周溶接線を基準として9,500mmの位置 とし、周方向には90°ピッチの約3,000mm間隔で4個 (4ch)のFOD センサを取り付けた。





Structure of the vertical reactor



**18** The position of FOD sensor installation and wiring for signal cable

Fig. 19に示すように、FOD センサを防水ケースで保 護し、反応器外表面の塗装をサンドペーパで除去した 後、耐熱エポキシ樹脂系接着剤を用いて接着して、そ の上からアルミテープを用いて固定した。各FODセ ンサから伸びた信号ケーブルはch1とch2, ch3とch4 をそれぞれジャンクボックスに集約し(Fig. 20参照)、 そこから地上までケーブルを伸ばしている。AE測定 を実施する時は、地上部に設置された端子ボックス と車に設置したFOD干渉計をケーブルで接続する (Fig. 21 参照)。このように、FOD センサを一度実機 に取り付ければ、センサから遠く離れた地上部から でも容易に検査を実施できることも本手法の大きな 利点の一つといえる。



Fig. 19

The condition of FOD sensor installation on the vertical reactor



Fig. 20 Connection of 4ch FOD sensor to junk BOX



Fig. 21 AE measurement condition in which FOD interferometer and collection analysis device are loaded into car

#### 3. 腐食部改修前後のAE測定結果

機器に発生したCUIによる錆びをケレン作業で除 去する前後でのAE測定結果をそれぞれFig. 22 および Fig. 23に示す。この結果、CUIによる錆びが存在す る状態では多くのAEが検出され、錆び除去後には AE検出数が1/10程度に激減していたことから、実機 においても腐食起因と思われるAEを検出できたと考 えられる。また、錆び除去前において各センサでAE の検出数に大きな差異があった。断熱材取り外し後 の目視検査で多数のAEを検出しているセンサ近傍に は複数の腐食箇所の存在が確認された。このように 実機を用いた実施試験でも錆びの状況とAEの検出状 況に良い相関関係があることを確認できた。

ただし、Fig. 23に示す錆び除去後に検出されたAE は腐食起因によるものではなく、現状の波形処理技 術によるフィルタリング処理では除去しきれなかっ た環境ノイズと思われる。本技術を現場適用するに はこの環境ノイズをいかに精度よく分別できるかが 極めて重要となる。





**Fig. 23** AE hits/30 minutes after removing rust

## 4. 環境ノイズ分別の検討

錆びの除去前後で検出されたそれぞれの代表的な AE波形および、CUIモックアップ配管の検討で得ら れた腐食からのAE波形をそれぞれFig. 24~Fig. 26に 示す。波形の立ち上がり、持続時間等良く似た形状



Fig. 24 Representative Waveform of AE obtained before removing rust



Fig. 25 Representative Waveform of AE obtained after removing rust



Fig. 26 Representative Waveform of AE obtained from mock-up piping

をしていることから、波形の形状による環境ノイズ 分別は困難と考えられる。

次に、錆びの除去前後で検出された測定時間3時間 でのAEのそれぞれのピーク周波数(周波数スペクトル の中で最大の振幅を持つ周波数)および重心周波数(周 波数スペクトルの面積の重心点となる周波数)の度数 分布をFig. 27 およびFig. 28に示す。いずれも周波数 帯域はCUIモックアップ配管の検討で得られた腐食 AEの周波数帯域(10k~150kHz)とほぼ同等であり、 また錆びの除去前後のAEのピーク周波数および重心





Frequency distribution of AE obtained before removing rust





Fig. 28 Frequency distribution of AE obtained after removing rust

周波数の度数分布ともに良く似た分布形状を示してい ることから、周波数解析による環境ノイズ分別も困難 と考えられる。

次に、錆びの除去前後で検出された測定時間3時間 でのAEのそれぞれの最大振幅とAE個数の度数分布 をFig. 29およびFig. 30に示す。錆びの除去前のAE は最大振幅の小さいものが多数存在し、最大振幅が 大きくなるに従って、AE個数は減少している。一方、 錆び除去後のAEは除去前のAEと概ね分布形状は似 ているものの、最大振幅の小さいものが最も多く存 在しているわけではなく、この度数分布には明らか な有意差が見られた。そこで、この結果をさらにわ かりやすく数値化するために、m値(分布関数の形状 パラメータ)による比較を試みた。m値とはFig. 29お よびFig. 30に示したAEの最大振幅と個数の度数分布 のグラフの両軸を対数表示とし、このときに得られ た散布図の直線の傾きである。錆びの除去前後で検 出されたそれぞれのAEおよび、CUIモックアップ配 管の検討で得られた腐食AEのm値をFig. 31に示す。

この結果、錆び除去前後のAEのそれぞれのm値は -2.23 および-1.71であり、CUIモックアップ配管の腐 食からのAEのm値は-2.67となった。錆び除去前の AEの度数分布はCUIモックアップ配管の腐食からの AEの度数分布とよく似ており、錆び除去後のAEと



**Fig. 29** Distribution of AE hits and maximum amplitude obtained before removing rust



**Fig. 30** Distribution of AE hits and maximum amplitude obtained after removing rust



Fig. 31 Comparison by *m* value (Shape parameter)

は度数分布が異なっていることが確認された。この ような結果からm値を求めることによって、腐食に よるAEと環境ノイズによるAEを分別できる可能性 が示唆された。

ただし、この分別技術を現場に適用していくため には、更なる実験室ベースでの基礎データの蓄積お よび、現場での実機テストを重ねていくことによっ て、腐食によるAEと環境ノイズとの分別データの蓄 積が必要である。

# まとめ

錆びこぶから発生したAEを、概ね10k~150kHzの 周波数範囲で捕捉した。また最長約4,000mmでもAE を捕捉可能であることを示した。これは左右8,000mm の範囲を一つのセンサで検査可能であることを示して おり、感度に余裕があったことから、さらに長距離の 検査も可能と考えられる。またフランジ部にセンサを 設置しても配管部同様にAEを捕捉することができ た。また実機においても腐食起因と思われるAEを検 出でき、環境ノイズについてもm値(形状パラメー タ)を評価することによって、腐食AEとの分別が可 能であることが示唆された。光ファイバー型AEセン サは元々防爆性を有するため、石油化学プラントの ような防爆地域を有するプラント内においてもセン サ部の常設が可能となる。今後更にデータを蓄積し、 早急に実用化を進めたい。

### 引用文献

- 1) 原修一,山本勝美,防錆管理,53 (3),106 (2009).
- 2) 多田 豊和,森久和,長秀雄,町島祐一,日本非 破壞検査協会平成20年度秋季大会講演概要集, 243 (2008).
- K. Kageyama, H. Murayama, K. Uzawa, I. Ohsawa, M. Kanai, Y. Akematsu, K. Nagata and T. Ogawa, Journal of Lightwave Technology, 24, 1768 (2006).
- 4) 住友化学(株), 特許出願中.
- 5) 住友化学(株), 特許出願中.

# PROFILE



**多田 豊和** *Toyokazu TADA* 住友化学株式会社 生産技術センター 研究員



森 久和 *Hisakazu Mori* 住友化学株式会社 生産技術センター 研究員



**末次 秀彦** *Hidehiko SUETSUCU* 住友化学株式会社 生産技術センター 主席研究員